

Symbol	Typ	Titel
G	Sektion	Sektion G – Physik
G01	Untersektion	Instrumente
G01	Klasse	Messen; Prüfen
G01Q	Unterklasse	Rastersondentechniken oder Vorrichtungen hierfür; Anwendung von Rastersondentechniken, z.B. Rastersondenmikroskopie [Scanning-Probe Microscopy = SPM] [2010.01]
G01Q 10/00	Hauptgruppe	Abtast- oder Positionieranordnungen, d.h. Anordnungen zur aktiven Steuerung der Bewegung oder der Position der Sonde [2010.01]
G01Q 10/02	1-Punkt Untergruppe .	Grobes Abtasten (Scannen) oder Positionieren [2010.01]
G01Q 10/04	1-Punkt Untergruppe .	Feines Abtasten (Scannen) oder Positionieren [2010.01]
G01Q 10/06	2-Punkt Untergruppe . .	Schaltungen oder Algorithmen hierfür [2010.01]
G01Q 20/00	Hauptgruppe	Überwachung der Bewegung oder der Position der Sonde [2010.01]
G01Q 20/02	1-Punkt Untergruppe .	durch optische Mittel [2010.01]
G01Q 20/04	1-Punkt Untergruppe .	Selbst-detektierende Sonden, d.h. die Sonde selbst erzeugt ein für ihre Position repräsentatives Signal, z.B. piezoelektrische Sensoren [2010.01]
G01Q 30/00	Hauptgruppe	Hilfsmittel zur Unterstützung oder Verbesserung von Rastersondentechniken oder -vorrichtungen, z.B. Anzeige- oder Datenverarbeitungseinrichtungen [2010.01]
G01Q 30/02	1-Punkt Untergruppe .	Nicht-SPM Analyseeinrichtungen, z.B. Rasterelektronenmikroskopie [Scanning Electron Microscope = SEM], Spektrometer oder optische Mikroskopie [2010.01]
G01Q 30/04	1-Punkt Untergruppe .	Anzeige- oder Datenverarbeitungseinrichtungen [2010.01]
G01Q 30/06	2-Punkt Untergruppe . .	zur Fehlerkompensation [2010.01]
G01Q 30/08	1-Punkt Untergruppe .	Mittel zum Schaffen oder Einstellen einer gewünschten Umgebungsbedingung innerhalb einer Probenkammer [2010.01]
G01Q 30/10	2-Punkt Untergruppe . .	thermische Umgebung [2010.01]
G01Q 30/12	2-Punkt Untergruppe . .	fluide Umgebung [2010.01]
G01Q 30/14	3-Punkt Untergruppe . . .	flüssige Umgebung [2010.01]
G01Q 30/16	2-Punkt Untergruppe . .	Vakuumumgebung [2010.01]
G01Q 30/18	1-Punkt Untergruppe .	Mittel zum Schützen oder Isolieren des Inneren einer Probenkammer vor äußeren Umgebungsbedingungen oder -einflüssen, z.B. Schwingungen oder elektromagnetischen Feldern [2010.01]
G01Q 30/20	1-Punkt Untergruppe .	Vorrichtungen oder Verfahren für die Probenhandhabung [2010.01]
G01Q 40/00	Hauptgruppe	Kalibrierung, z.B. von Sonden [2010.01]
G01Q 40/02	1-Punkt Untergruppe .	Kalibrierstandards und Verfahren zu deren Herstellung [2010.01]
G01Q 60/00	Hauptgruppe	Besondere Arten der Rastersondenmikroskopie [SPM] oder Vorrichtungen hierfür; wesentliche Bestandteile hiervon [2010.01]
G01Q 60/02	1-Punkt Untergruppe .	Kombinierte SPM-Methoden, die zwei oder mehr SPM-Techniken umfassen [2010.01]
G01Q 60/04	2-Punkt Untergruppe . .	Rastertunnel-Mikroskopie [Scanning Tunnelling Microscopy = STM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01]
G01Q 60/06	2-Punkt Untergruppe . .	optische Rasternahfeldmikroskopie [Scanning Near-field Optical Microscopy = SNOM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01]

Symbol	Typ	Titel
G01Q 60/08	2-Punkt Untergruppe	... <i>Magnetkraftmikroskopie [Magnetic Force Microscopy = MFM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM]</i> [2010.01]
G01Q 60/10	1-Punkt Untergruppe	... <i>Rastertunnel-Mikroskopie [Scanning Tunnelling Microscopy = STM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. STM-Sonden</i> [2010.01]
G01Q 60/12	2-Punkt Untergruppe	... <i>Rastertunnel-Spektroskopie [Scanning Tunnelling Spectroscopy = STS]</i> [2010.01]
G01Q 60/14	2-Punkt Untergruppe	... <i>Rastertunnel-Potentiometrie [Scanning Tunnelling Potentiometry = STP]</i> [2010.01]
G01Q 60/16	2-Punkt Untergruppe	... <i>Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen</i> [2010.01]
G01Q 60/18	1-Punkt Untergruppe	... <i>optische Rasternahfeldmikroskopie [Scanning Near-Field Optical Microscopy = SNOM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SNOM-Sonden</i> [2010.01]
G01Q 60/20	2-Punkt Untergruppe	... <i>Fluoreszenz</i> [2010.01]
G01Q 60/22	2-Punkt Untergruppe	... <i>Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen</i> [2010.01]
G01Q 60/24	1-Punkt Untergruppe	... <i>Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. AFM-Sonden</i> [2010.01]
G01Q 60/26	2-Punkt Untergruppe	... <i>Reibungskraft-Mikroskopie</i> [2010.01]
G01Q 60/28	2-Punkt Untergruppe	... <i>Adhäsionskraft-Mikroskopie</i> [2010.01]
G01Q 60/30	2-Punkt Untergruppe	... <i>Potential-Rastermikroskopie</i> [2010.01]
G01Q 60/32	2-Punkt Untergruppe	... <i>AC-Modus</i> [2010.01]
G01Q 60/34	3-Punkt Untergruppe	... <i>Tapping-Modus</i> [2010.01]
G01Q 60/36	2-Punkt Untergruppe	... <i>DC-Modus</i> [2010.01]
G01Q 60/38	2-Punkt Untergruppe	... <i>Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen</i> [2010.01]
G01Q 60/40	3-Punkt Untergruppe	... <i>Leitfähige Sonden</i> [2010.01]
G01Q 60/42	3-Punkt Untergruppe	... <i>Funktionalisierung</i> [2010.01]
G01Q 60/44	1-Punkt Untergruppe	... <i>Ionenleitfähigkeits-Rastermikroskopie [Scanning Ion-Conductance Microscopy = SICM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SICM-Sonden</i> [2010.01]
G01Q 60/46	1-Punkt Untergruppe	... <i>Kapazitätsrastermikroskopie [Scanning Capacitance Microscopy = SCM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SCM-Sonden</i> [2010.01]
G01Q 60/48	2-Punkt Untergruppe	... <i>Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen</i> [2010.01]
G01Q 60/50	1-Punkt Untergruppe	... <i>Magnetkraftmikroskopie [Magnetic Force Microscopy = MFM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. MFM-Sonden</i> [2010.01]
G01Q 60/52	2-Punkt Untergruppe	... <i>Resonanz</i> [2010.01]
G01Q 60/54	2-Punkt Untergruppe	... <i>Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen</i> [2010.01]
G01Q 60/56	3-Punkt Untergruppe	... <i>Sonden mit magnetischer Beschichtung</i> [2010.01]
G01Q 60/58	1-Punkt Untergruppe	... <i>thermische Rastermikroskopie [Scanning Thermal Microscopy = SThM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SThM -Sonden</i> [2010.01]
G01Q 60/60	1-Punkt Untergruppe	... <i>elektrochemische Rastermikroskopie [Scanning Electro-Chemical Microscopy = SECM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SECM-Sonden</i> [2010.01]
G01Q 70/00	Hauptgruppe	Allgemeine Aspekte zu SPM-Sonden, deren Herstellung und zugehörigen Geräten, sofern sie nicht in besonderer Weise für eine einzelne der SPM-Techniken unter G01Q 60/00 ausgebildet sind

Symbol	Typ	Titel
[2010.01]		
G01Q 70/02	1-Punkt Untergruppe . Sondenhalterungen	[2010.01]
G01Q 70/04	2-Punkt Untergruppe . . mit Kompensation für temperatur- oder schwingungsinduzierte Fehler	[2010.01]
G01Q 70/06	1-Punkt Untergruppe . Arrays von Sondenspitzen	[2010.01]
G01Q 70/08	1-Punkt Untergruppe . Sondencharakteristik	[2010.01]
G01Q 70/10	2-Punkt Untergruppe . . Form und Konizität	[2010.01]
G01Q 70/12	3-Punkt Untergruppe . . Nanoröhrchen-Spitzen	[2010.01]
G01Q 70/14	2-Punkt Untergruppe . . besondere Materialien	[2010.01]
G01Q 70/16	1-Punkt Untergruppe . Sondenherstellung	[2010.01]
G01Q 70/18	2-Punkt Untergruppe . . Funktionalisierung	[2010.01]
G01Q 80/00	Hauptgruppe	Anwendungen von anderen Rastersondentechniken als SPM (Herstellung oder Behandlung von Mikrostrukturen B81C; Herstellung oder Behandlung von Nanostrukturen B82B 3/00; Aufzeichnen oder Wiedergabe von Information mittels Nahfeldwechselwirkung G11B 9/12, G11B 11/24 oder G11B 13/08) [2010.01]
G01Q 90/00	Hauptgruppe	Rastersondentechniken und -vorrichtungen soweit nicht anderweitig vorgesehen [2010.01]